

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
VEECO
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ που βρίσκεται στην Ορμύλια Χαλκιδικής για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM).

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler. Θα υπάρχει εγκατεστημένο όργανο AFM (Model NanoScope SP / MultiMode) το οποίο θα επιδειχθεί κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

09.30-10.00	Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά	
10:00-10:10	Welcome to the Seminar	Δ. Σταμέλος
10.10-10:30	Veeco Introduction	Dr.H.Stadler
10:30-11:30	Nanoscale Characterization Techniques	Dr. H. Stadler
11:30-11.45	Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά	
11:45-12:45	Advance in SPM Instrumentation	Dr. H. Stadler
12:45-13:15	Ελαφρύ γεύμα	
13:15-14:30	SPM/AFM Application	Dr. H. Stadler
14:30-16:30	Workshop with NanoScope 3D/Multimode & Questions	Dr. H. Stadler

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Παρασκευή 4 Μαΐου 2007, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210 6748 973 ή fax 210 6748 978, ή e-mail r.georgiou@analytical.gr